

光干渉方式を用いたフィルム業界アプリケーション

VS1000 Series

Coherence Scanning Interferometry

◎ 走査型白色干渉顕微鏡による表面形状・膜厚測定

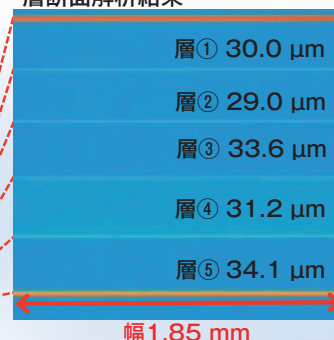
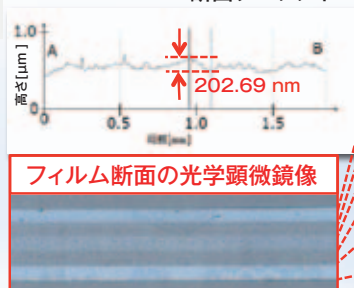
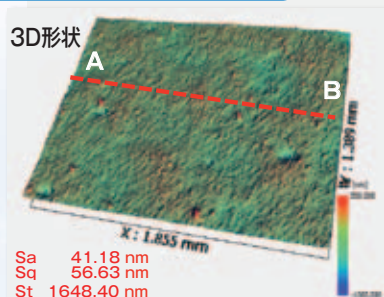


包装フィルム 測定例

表面粗さ・膜厚管理

断面プロファイル

層断面解析結果

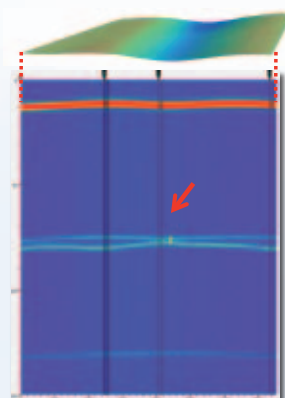
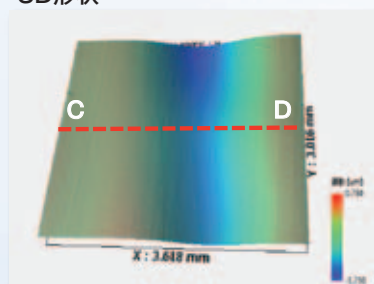


光学フィルム 欠陥部の評価

打痕不良・フィッシュアイなどの欠陥評価

3D形状

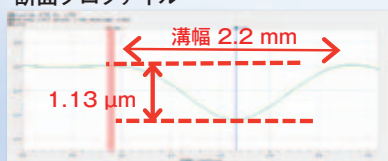
層断面解析結果



層① 40 μm
層② 2 μm
層③ 40 μm

層②厚み分布にムラを確認
中央部に気泡

断面プロファイル



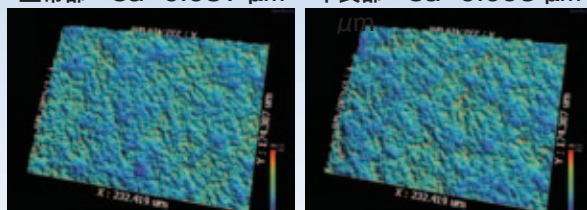
どの層で不良が起きているか非破壊で確認

目視で見られるスジ不良の評価

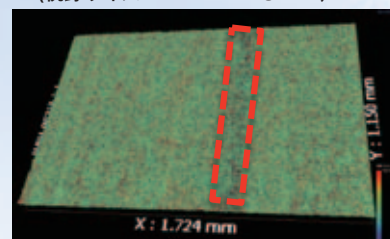
擦過キズ・塗工スジなど目視で見られる不良評価

■ 単視野データ(視野サイズ: 232x174 μm)

正常部 Sa=0.087 μm 不良部 Sa=0.093 μm



■ 72視野 画像連結データ
(視野サイズ: 1.72x1.15 mm)



狭い範囲のデータのみではわからない
わずかな粗さの差を広範囲データ解析で明確化

